

Librería
Bonilla y Asociados
desde 1950



Título: Scanning Electron Microscopy And X-Ray Microanalysis

Autor: Goldstein, Joseph

Precio: \$900.00

Editorial:

Año:

Tema:

Edición: 2003

Sinopsis

ISBN: 0306472929

The third edition of this highly acclaimed text has been extensively revised.